Avilov / Dudarev / Marks

Electron Microscopy and Multiscale Modeling

Proceedings of The EMMM-2007 International Conference

The EMMM-2007 Conference brought together leading experts in electron microscopy and materials modeling from around the world to explore how to synergistically combine atomic scale characterization and modeling to enhance the development of new materials.



153,49 €
143,45 € (zzgl. MwSt.)

Nicht mehr lieferbar

Artikelnummer: 9780735405196
Medium: Buch
ISBN: 978-0-7354-0519-6
Verlag: AIP Press
Erscheinungstermin: 29.04.2008
Sprache(n): Englisch
Auflage: 1. Auflage 2008
Serie: AIP Conference Proceedings
Produktform: Gebunden
Seiten: 300
Format (B x H): 162 x 234 mm



Kundenservice Verlag Dr. Otto Schmidt KG
Neumannstraße 10, 40235 Düsseldorf | kundenservice@otto-schmidt.de | 0221-93738-997 (Inland)